

SEMICONDUCTOR TEST SYSTEM & INDUCTIVE LOAD TESTER / 半導体テストシステム & L負荷テスター MODEL:CHT2020Z & LVNJ20ZFC

This system can carry out DC and inductive load test at measurement unit of overhead mechanism in consideration of wafer measurement with prober by continuance.

It has high-speed power supply break function by the protection circuit in head box at unusual waveform detection with inductive load test.

本器は、プローバーでのウェハ測定を考慮した、オーバーヘッド機構の測定部により、DC測定とL負荷測定を連続でできるテストシステムです。

L負荷測定での異常波形検出時は、ヘッドボックス内の保護回路により、高速で電源を遮断する機能が装備されています。



【DC Measurement Specifications / DC測定仕様】

- 1) Polarity / 極性 : NPN, PNP
- 2) Voltage / 電圧 : 2000V
- 3) Current / 電流 : 200A

【L load Measurement Specifications / L負荷測定仕様】

- 1) Setting Range / 設定範囲 : V_{DD} 001V~200V、 I_D 0.20A~200A



半導体デバイス試験装置メーカー

株式会社 キヤッツ電子設計

CONTACT

■TEL : CATS Inc. SENDAI OFFICE TEL.022-371-8777

■E-mail : cats-sendai@world.ocn.ne.jp

* Reproduction or appropriation of writings, images and photographs from within this catalogue is prohibited.

* 本カタログ内の記述、画像、写真の無断転載・転用を禁止します。